УДК 537.87, 537.9

# СТАБИЛИЗАЦИЯ ФОРМЫ УЕДИНЕННОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В ГРАФЕНОВОЙ СВЕРХРЕШЕТКЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

С.В. Крючков<sup>\*,\*\*</sup>, Е.И. Кухарь<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup>Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Лаборатория физики низкоразмерных систем\*, Волгоград 400066, Россия
\*\*Волгоградский государственный технический университет, Волгоград 400005, Россия E-mail: eikuhar@yandex.ru

<sup>\*</sup> http://edu.vspu.ru/physlablds

Исследовано высокочастотного электромагнитного влияние излучения распространение уединенных электромагнитных волн в графеновой сверхрешетке с учетом диссипации. Найдено выражение для потенциала диссипативного солитона. Показано, форма диссипативного солитона зависит амплитуды высокочастотного излучения. Найдены интервалы амплитуд высокочастотного поля, для которых в графеновой сверхрешетке формируются два типа диссипативных солитонов. Показано, что площади этих солитонов регулируются изменением амплитуды высокочастотного излучения.

PACS: 72.20.Ht, 72.80.Vp, 73.21.Cd, 78.67.Wj, 41.20.Jb

Работа поддержана грантом РФФИ № 13-02-97033 р\_поволжье\_а, и выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания №2014/411 (код проекта: 522).

#### 1. Введение

Возможности использования графеновых структур в оптоэлектронике обуславливают повышенный интерес среди исследователей к изучению нелинейных электрических и оптических эффектов в таких материалах [1-8]. Оптические свойства графена исследовались теоретически и экспериментально в [2-4,9-13]. Изученные нелинейные оптические свойства графеновых структур открывают новые перспективы в оптоэлектронном приборостроении [8,14-16]. В [3,11] обсуждалось применение графеновых структур для генерации электромагнитного (ЭМ) излучения терагерцового (ТГц) диапазона. В [8,15,16] продемонстрировано использование поглотителя на основе графена для генерации ЭМ импульсов длительностью менее чем 200 fs.

Интерес к электронному транспорту в графеновых сверхрешетках (ГСР) [3,13,17-23] вызван возможностями использования сверхрешеток (СР) в качестве рабочей среды генераторов и усилителей ТГц ЭМ излучения [24,25], а также для формирования уединенных ЭМ волн [26-31]. Например, для генерации солитонов в полупроводниковой СР требуются меньшие электрические поля (~1 kV/cm), чем в объемных кристаллах [26]. Распространение ЭМ 2π-импульса в ГСР теоретически изучено в [30,31].

Формирование нелинейных волн в полупроводниковых структурах связано с движением электронов в поле волны как целого. Такое коллективное поведение электронного газа разрушается за время, равное по порядку величины времени релаксации [26,29]. Это приводит к сильному затуханию солитонов, что является препятствием их использованию для передачи информации на большие расстояния. В полупроводниковых СР, например, длина пробега ЭМ солитона составляет менее 1 mm. Поэтому в настоящее время актуален поиск способов усиления и стабилизации формы уединенных ЭМ волн [32,33]. Подвижность носителей заряда в графене (которая определяется временем релаксации) значительно превышает подвижность носителей заряда даже в относительно чистых полупроводниковых СР [1]. Это позволяет надеяться, что использование ГСР значительно увеличит длину пробега уединенных ЭМ волн.

В [27,34,35] для стабилизации формы солитона в полупроводниковой СР предлагалось использовать высокочастотное (ВЧ) лазерное излучение. Наличие дополнительного ВЧ излучения приводило к динамической модификации электронного

спектра СР так, что при определенных амплитудах ВЧ поля последняя становилась средой с инверсной населенностью. В [27] показана возможность формирования в полупроводниковой СР так называемого диссипативного солитона, причем в достаточно мощном ВЧ поле время пробега солитона значительно увеличивается. Аналогичная ситуация рассмотрена в [34,35], где показано, что учет второй гармоники в электронном спектре полупроводниковой СР приводит к принципиально новым результатам.

Модификация электронного спектра графеновых структур в ВЧ ЭМ поле изучалась в [36-38], где предсказано динамическое наведение щели в изначально бесщелевом графене. Квазиэнергетический спектр ГСР, подверженной ВЧ ЭМ излучению, найден в [39], где изучено влияние ВЧ поля на распространение уединенных ЭМ волн в идеальной (без диссипации) ГСР.

Ниже исследуется стабилизация ВЧ ЭМ излучением формы уединенной ЭМ волны, распространяющейся в ГСР с учетом диссипации. Показано, что в ГСР возможно формирование диссипативного солитона. Однако в отличие от полупроводниковой СР площадь диссипативного солитона в ГСР зависит от амплитуды ВЧ поля.

#### 2. Усиление уединенной ЭМ волны, распространяющейся в идеальной ГСР

Один из способов изготовления ГСР основан на создании пространственной модуляции щели, наводимой в графене подложкой, состоящей из периодически чередующихся слоев  $SiO_2/SiC$  [17,20]. В [19-22] показано, что электронный спектр такой структуры может быть записан в виде:

$$\varepsilon(\mathbf{p}) = \sqrt{\Delta^2 + p_x^2 v_F^2 + \Delta_I^2 \left(1 - \cos\frac{p_y d}{\hbar}\right)},$$

где  $v_{\rm F}=10^8$  cm/s — скорость на поверхности Ферми, xy — графеновая плоскость, Oy — направление чередования слоев (ось ГСР), d — период ГСР, параметры  $\Delta$ ,  $\Delta_{\rm I}$  задаются в процессе изготовления ГСР и определяются прозрачностью формируемых в графене энергетических барьеров. Численный анализ [20] показал, что в случае подложки из периодически чередующихся слоев SiO<sub>2</sub>/SiC  $\Delta$  ~ 0.13 eV,  $\Delta_{\rm I}$  ~ 0.1 $\Delta$ .

Рассмотрим ситуацию, когда ГСР находится в поле двух ЭМ волн. Одна из этих волн является синусоидальной ВЧ волной, распространяется перпендикулярно графеновой плоскости и описывается векторным потенциалом:

$$\mathbf{A}^{\mathrm{HF}} = \left(0, -\frac{cE_0^{\mathrm{HF}}}{\omega}\sin\omega t, 0\right),\,$$

где  $E_0^{\rm HF}$  — амплитуда электрического поля ВЧ волны. Вторая волна с векторным потенциалом **A** распространяется так, что ее плоскость поляризации совпадает с графеновой плоскостью, а напряженность электрического поля направлена вдоль Oy. Форма последней волны определяется из уравнения д'Аламбера, записанного с учетом электрического тока, наводимого ЭМ полем вдоль Oy.

Пусть температура  $\theta$  и частота ВЧ излучения  $\omega$  удовлетворяют условиям:

$$\frac{n_0 \hbar^2 v_F^2}{\Lambda} << \theta << \Delta, \tag{1}$$

$$\omega \gg \omega_{\rm pl}$$
, (2)

где  $\omega_{\rm pl} = \sqrt{2\pi n_0}e^2\Delta_1^2d^2/\hbar^2a_0\Delta$  — плазменная частота,  $a_0$  — толщина графенового слоя,  $n_0$  — поверхностная концентрация свободных носителей заряда в графене. Кроме того, считаем  $\Delta_1 << \Delta$ . В этом случае, как показано в [39], уравнение д'Аламбера, записанное для ЭМ поля с потенциалом **A**, принимает вид уравнения double sine-Gordon:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \omega_{\rm pl}^2 (D(a) \sin \varphi + 2 \gamma G(a) \sin 2\varphi) = 0, \qquad (3)$$

где  $\pmb{\varphi}=edA_{_{y}}/\hbar c$  ,  $a=edE_{_{0}}^{\mathrm{HF}}/\hbar \omega$  ,  $\pmb{\gamma}=\left(\Delta_{_{1}}/\hbar \omega\right)^{2}$  ,

$$D(a) = J_0(a) + \frac{a^2}{8} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k+1)^2} \left[ J_k\left(\frac{a}{2}\right) + J_{k+2}\left(\frac{a}{2}\right) \right]^2, \ G(a) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} J_k^2(a)}{k^2},$$

 $J_k(a)$  — функция Бесселя целого порядка. Одним из решений уравнения (5) является потенциал, описывающий уединенный ЭМ импульс, площадь которого может регулироваться изменением амплитуды ВЧ поля [39].

Случай  $4\gamma |G(a)| > D(a)$  соответствует неустойчивым кинкам [41-43]. В этой ситуации возможно автомодельное решение уравнения (3), отвечающее усилению ЭМ импульса. Численный расчет, выполненный для  $\gamma = 0.1$ , показывает, что значения параметра a, удовлетворяющие условию неустойчивости кинка, лежат в одном из следующих интервалов: [4.359, 5.671]; [10.679, 11.951] и т.д.

Введем новые переменные:  $\xi = \omega_{\rm pl}(ct+x)/2c$  и  $\eta = \omega_{\rm pl}(ct-x)/2c$ . Тогда вместо (3) имеем:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \xi \partial \eta} = -4 \gamma G \sin \varphi (\lambda + \cos \varphi), \tag{4}$$

где  $\lambda = D(a)/4\gamma G(a)$ ,  $|\lambda| < 1$ . Для автомодельной переменной  $u = \xi \eta$  уравнение (4) перепишется в виде:

$$u\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}u^2} + \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}u} = -4\gamma G\sin\varphi(\lambda + \cos\varphi). \tag{5}$$

Уравнение (5) имеет регулярные при  $x = \pm ct$  решения. Эти решения таковы, что производная  $\varphi'_u$  по переменной u представляет собой волновой пакет монополярный в окрестности точки u = 0. Напряженность электрического поля связана с решением уравнения (5) следующим соотношением:

$$E_{y}(x,t) = \frac{\hbar \omega_{pl}^{2} x}{ced} \varphi'_{u}(x,t).$$
 (6)

Как видно из (6) по мере распространения ЭМ импульса его амплитуда возрастает. Отметим, что аналогичная ситуация исследована в [27,40] для системы, описываемой уравнением sine-Gordon. Как и в [27,40] усиление импульса связано с сильным перераспределением электронов по минизоне, вызванным действием ВЧ ЭМ излучения.

Зависимость энергии электронов  $\langle \varepsilon \rangle$ , усредненной по каноническому ансамблю и периоду ВЧ волны, от амплитуды ВЧ волны показана на рисунке 1 (температура  $\theta$  = 77.4 K). Видно, что для определенных интервалов амплитуд a ВЧ поле сильно перераспределяет электронный газ по минизоне, так что значение  $\langle \varepsilon \rangle$  превышает энергию, соответствующую середине минизоны. Заштрихованная область — область, соответствующая неустойчивым кинкам, — оказывается внутри этих интервалов. ГСР в этом случае является средой с инверсной населенностью, поэтому ЭМ импульс, распространяющийся вдоль графенового слоя, должен усиливаться.

#### 3. Диссипативный солитон в ГСР

Усиление ЭМ импульса происходит до тех пор, пока энергия, снимаемая в инвертированной среде уединенной волной за единицу времени, не сравняется с

энергией, теряемой за единицу времени за счет диссипации. Диссипация, препятствующая усилению импульса, связана как с рассеянием носителей заряда на неоднородностях графена, так и с поглощением на межминизонных переходах. Для учета диссипации добавим в левую часть уравнения (3) слагаемое  $\beta \partial \varphi / \partial t$ , где  $\beta$  – феноменологическая постоянная [29]. В результате имеем:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \beta \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \omega_{pl}^2 (D(a) \sin \varphi + 2\gamma G(a) \sin 2\varphi) = 0.$$
 (7)

Известно, что в формировании солитонов в СР решающую роль играет периодичность скорости движения электронов в узкой зоне проводимости [26]. В ГСР ВЧ поле приводит не только к динамическому сужению минизоны, как в СР на основе AlAs/AlGaAs [27], но и к изменению структуры зоны Бриллюэна так, что блоховские осцилляции электронов становятся негармоническими. Следствием этого, в частности, является влияние ВЧ поля на площадь солитонов, распространяющихся в ГСР. Если амплитуда ВЧ поля a является нулем функции D(a), то период обратной решетки уменьшится в 2 раза по сравнению со случаем отсутствия ВЧ излучения [39]. В этой ситуации вместо  $2\pi$ -импульса в идеальной ГСР распространяется  $\pi$ -импульс [39]. Подобного эффекта следует ожидать и в ГСР с учетом диссипации.

Для нахождения решений уравнения (7), соответствующих уединенным ЭМ волнам, введем переменную:  $\xi = (x-ct)\omega_{\rm pl}^2/\beta c$ . В результате вместо (7) получим:

$$\varphi_{\varepsilon}' = -F(\varphi),\tag{8}$$

где

$$F(\varphi) = D(a)\sin\varphi + 2\gamma G(a)\sin 2\varphi. \tag{9}$$

После интегрирования в (8) с начальным условием  $\varphi(0) = \varphi_{\rm m}$ , где  $\varphi_{\rm m}$  – потенциал, соответствующий максимуму абсолютного значения напряженности  $E_{\rm y}$  ЭМ импульса, получим:

$$4\gamma G(1-\lambda^2)\xi = 2\lambda \ln\left(\operatorname{tg}\frac{\varphi_{\rm m}}{2}\operatorname{ctg}\frac{\varphi}{2}\right) + \ln\left(\frac{\lambda + \cos\varphi}{\lambda + \cos\varphi_{\rm m}}\frac{\sin\varphi}{\sin\varphi_{\rm m}}\right),\tag{10}$$

или

$$D(\lambda_1^2 - 1)\xi = 2\ln\left(\operatorname{tg}\frac{\varphi_{\rm m}}{2}\operatorname{ctg}\frac{\varphi}{2}\right) + \lambda_1\ln\left(\frac{1 + \lambda_1\cos\varphi}{1 + \lambda_1\cos\varphi_{\rm m}}\frac{\sin\varphi}{\sin\varphi_{\rm m}}\right),\tag{11}$$

где  $\lambda_1 = \lambda^{-1}$ . Выражение (10) (или (11)) описывает стационарную уединенную ЭМ волну, снимающую энергию в ГСР с инверсной населенностью и рассеивающую ее за счет межминизонных переходов. Такое локализованное состояние называют диссипативным солитоном [32]. Для полупроводниковой СР динамика диссипативного солитона ( $\pi$ -импульса) изучена в [27,34,35]. Однако в отличие от полупроводниковой СР в ГСР площадь диссипативного импульса (10) может отличаться от  $\pi$  и регулируется изменением амплитуды ВЧ излучения. В частности, если амплитуда  $a_n^D$  является n-м нулем функции D(a), то из (10) следует:  $\cos 2\varphi = \text{th}(4\gamma G_n \xi)$ , и потенциал  $\varphi$  описывает распространение ( $\pi/2$ )-импульса (здесь  $G_n = G(a_n^D)$ ). Для k-го нуля  $a_k^G$  функции G(a) из (11) следует:  $\cos \varphi = \text{th}(D_k \xi)$ , а потенциал  $\varphi$  соответствует  $\pi$ -импульсу (здесь  $D_k = D(a_k^G)$ ).

#### 4. Амплитуда и площадь диссипативного солитона в ГСР

Найдем амплитуду диссипативного солитона. В случае  $\lambda > -1$  потенциал  $\varphi_{\rm m}$  определится из формулы:

$$\cos \varphi_{\rm m}^{\rm a} = \frac{\sqrt{8 + \lambda^2} - \lambda}{4}.$$

Тогда амплитуда напряженности электрического поля солитона равна:

$$E_{ym}^{a} = -E_0 \gamma G \left( \sqrt{8 + \lambda^2} + 3\lambda \right) \sqrt{4 - \lambda^2 + \lambda \sqrt{8 + \lambda^2}} , \qquad (12)$$

где  $E_0 = \hbar \omega_{\rm pl}^2 / 2\sqrt{2}ed\beta$ . Из (12) видно, что если  $\lambda > -1$ , то при  $\varphi = \varphi_{\rm m}^{\rm a}$  напряженность поля солитона имеет отрицательную проекцию (рис 2, антикинк).

В случае  $\lambda$  < 1 потенциал  $\phi_{\rm m}$  определится из выражения:

$$\cos \varphi_{\rm m}^{\rm k} = -\frac{\sqrt{8+\lambda^2}+\lambda}{4}.$$

Тогда амплитуда напряженности электрического поля солитона имеет вид:

$$E_{vm}^{k} = E_0 \gamma G \left( \sqrt{8 + \lambda^2} - 3\lambda \right) \sqrt{4 - \lambda^2 - \lambda \sqrt{8 + \lambda^2}} . \tag{13}$$

Из (13) видно, что если  $\lambda < 1$ , то при  $\varphi = \varphi_m^k$  напряженность электрического поля солитона имеет положительную проекцию (рис 2, кинк).

Если  $-1 < \lambda < 1$ , то возможно распространение как кинка, так и антикинка. В этом случае площади импульсов определяются амплитудой ВЧ поля и равны  $\varphi_0 = \pm \arccos(-\lambda)$ . Зависимости амплитуды электрического поля и площади диссипативного солитона от a показаны на рисунках 2 и 3 соответственно.

### 5. Увлечение носителей заряда в ГСР диссипативным солитоном

Одним из проявлений существования диссипативного солитона в ГСР, описанного выше, может выступить эффект увлечения электронов такой волной [26] — возникновение тока в направлении распространения волны. Природа этого эффекта сходна с природой радиоэлектрического эффекта и объясняется как результат передачи импульса ЭМ волной электронной подсистеме [26]. Чтобы оценить заряд, переносимый диссипативным солитоном вдоль своего направления, воспользуемся следующим выражением для плотности тока увлечения [30]:

$$j_x = -\frac{n_0 e}{a_0} \frac{p_1 v_F^2}{\sqrt{\Delta^2 + p_1^2 v_F^2}},$$

где  $p_1$  — средний импульс одного электрона, равный отношению плотности импульса, передаваемой электронной подсистеме ЭМ волной в направлении оси Ox к концентрации электронов:  $p_1 = a_0 E_y^2 / 4\pi c n_0$ . Таким образом:

$$j_x = -\frac{j_0 \chi F^2(\varphi)}{\sqrt{1 + \chi^2 F^4(\varphi)}},$$

где  $j_0 = e n_0 v_{\rm F}/a_0$ ,  $\chi = \Delta_1^2 \omega_{\rm pl}^2 v_{\rm F}/\Delta^2 \beta^2 c$ . Электрический заряд, переносимый ЭМ импульсом вдоль оси Ox, равен  $(|\lambda| < 1)$ :

$$Q = \frac{j_0 \beta \chi}{\omega_{\text{pl}}^2} \int_0^{\omega_{\text{pl}}} \frac{F(\varphi) d\varphi}{\sqrt{1 + \chi^2 F^4(\varphi)}},$$
 (14)

Подставляя (9) в (14) и учитывая, что выполняется условие:  $\chi << 1$ , получим:

$$Q(a) = \mp \frac{2j_0\beta\chi}{\omega_{\rm pl}^2} \gamma G(a)(1\pm\lambda(a))^2. \tag{15}$$

Здесь верхний знак выбирается для антикинка, а нижний знак — для кинка. Для следующих значений параметров [3,17]:  $\Delta = 0.13$  eV,  $n_0 = 10^9$  cm $^{-2}$ ,  $d = 2 \times 10^{-6}$  cm,

 $E_0^{\rm HF} = 5 \times 10^4 \ {
m V/cm}$ , заряд, увлекаемый кинком, согласно (15), составляет  $Q \sim 5 \ {
m pC/cm}^2$ , что может быть измерено в эксперименте.

#### 6. Заключение

Выше описана возможность распространения в ГСР диссипативного солитона, стабильность которого обеспечивается за счет энергии носителей заряда в инвертированной минизоне. Инверсная населенность в ГСР достигается внешним ВЧ излучением, амплитуда электрического поля которого лежит в интервале:  $4.4 \times 10^4$  V/cm  $< E_0^{\rm HF} < 5.7 \times 10^4$  V/cm. В отличие от полупроводниковой СР площадь диссипативного солитона в ГСР зависит от амплитуды ВЧ излучения (рис. 3) и может быть отлична от  $\pi$ . Профили диссипативных солитонов при различных значениях параметра a показаны на рисунке 4 (сплошные линии – кинки, пунктирные линии – антикинки). Как уже говорилось, зависимость площади диссипативного солитона от амплитуды ВЧ поля является следствием модификации ВЧ излучением электронного спектра, которая приводит к негармоничности блоховских колебаний электронов в минизоне ГСР.

Оценим температуру  $\theta$  и частоту  $\omega$ , при которых выполнены условия (1) и (2). Согласно (1) и (2), для выше указанных значений параметров температура лежит в интервале: 10 К  $<<\theta<<10^3$  К, а частота ВЧ излучения удовлетворяет неравенству:  $\omega>>10^{13}$  Гц. Поэтому приведенные выше рассуждения справедливы, если использовать, например, температуру кипения азота ( $\sim$  77,4 K) и ЭМ излучение с частотой  $\omega\sim10^{14}\,\mathrm{s}^{-1}$ .

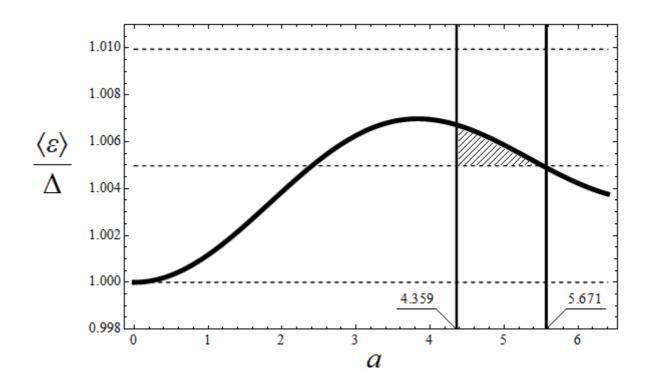
Работа поддержана грантом РФФИ № 13-02-97033 р\_поволжье\_а, и выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания №2014/411 (код проекта: 522).

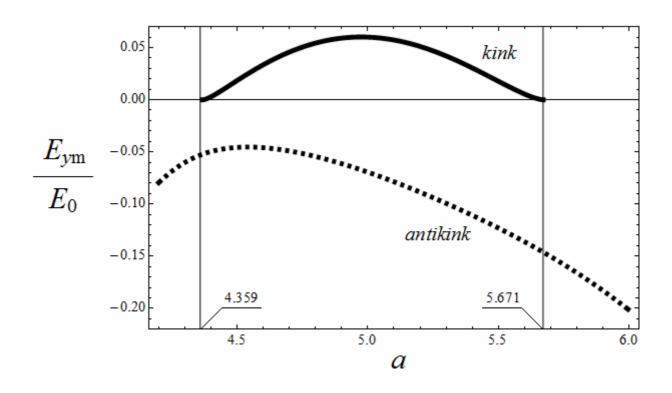
## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

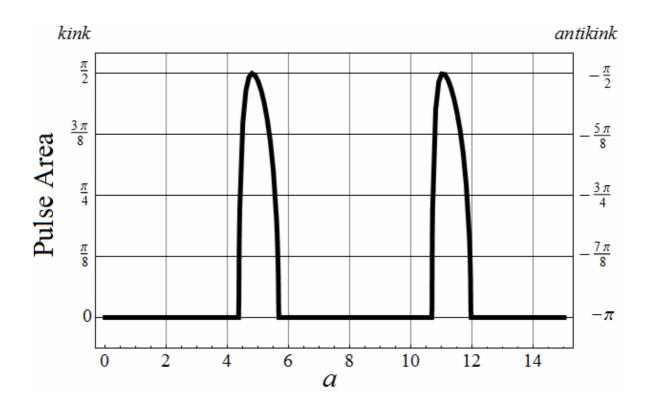
- 1. Peres N.M.R., Guinea F., Castro Neto A.H. // Physical Review B. 2006. V. 73. P. 125411.
- 2. Sadowski M.L., Martinez G., Potemski M., Berger C., de Heer W.A. // Physical Review

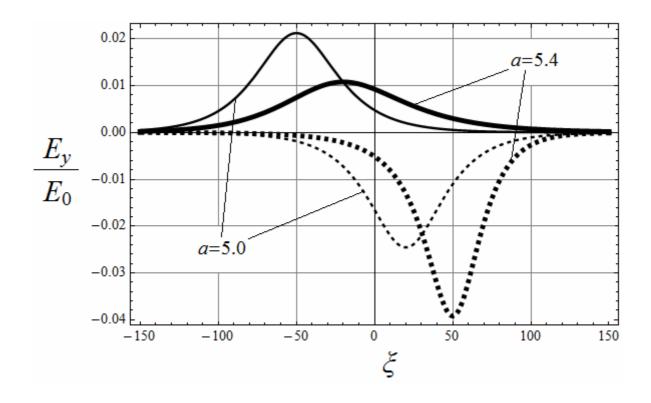
- Letters. 2006. V. 97. P. 266405.
- 3. Фальковский Л.А. // УФН. 2008. Т. 178. № 9. С. 923.
- 4. Mikhailov S.A. // Physica E. 2008. V. 40. P. 2626.
- 5. Abergel D.S.L., Chakraborty T. // Applied Physics Letters. 2009. V. 95. P. 062107.
- 6. Bolmatov D., Mou C.-Y. // Physica B. 2010. V. 405. P. 2896.
- 7. Abergel D.S.L., Apalkov V., Berashevich J., Ziegler K., Chakraborty T. // Advances in Physics. 2010. V. 59. P. 261.
- 8. Popa D., Sun Z., Torrisi F., Hasan T., Wang F., Ferrari A.C. // Applied Physics Letters. 2010. V. 97. P. 203106.
- 9. Gusynin V.P., Sharapov S.G., Carbotte J.P. // Journal of Physics: Condensed Matter. 2007. V. 19. P. 026222
- 10. Nair R.R., Blake P., Grigorenko A.N., Novoselov K.S., Booth T.J., Stauber T., Peres N.M.R., Geim A.K. // Science. 2008. V. 320. P. 1308.
- 11. Mikhailov S.A., Ziegler K. // Journal of Physics: Condensed Matter. 2008. V. 20. P. 384204.
- 12. Zhang X.-L., Zhao X., Liu Z.-B., Shi S., Zhou W.-Y., Tian J.-G., Xu Y.-F., Chen Y.-S. // Journal of Optics. 2011. V. 13. P. 075202.
- 13. Neetu Agrawal (Garg), Ghosh S., Sharma M. // International Journal of Modern Physics B. 2013. V. 27. P. 1341003.
- 14. Liu Z.-B., Li L., Xu Y.-F., Liang J.-J., Zhao X., Chen S.-Q., Chen Y.-S., Tian J.-G. // Journal of Optics. 2011. V. 13. P. 085601.
- 15. Konstantatos G., Badioli M., Gaudreau L., Osmond J., Bernechea M., Garcia de Arquer F.P., Gatti F., Koppens F.H.L. // Nature Nanotechnology. 2012. V. 7. P. 363.
- 16. Thongrattanasiri S., Koppens F.H.L., Garcia de Abajo F.J. // Physical Review Letters. 2012. V. 108. P. 047401
- 17. Ратников П.В. // Письма в ЖЭТФ. 2009. Т. 90. В. 6. С. 515.
- 18. Bolmatov D., Mou C.-Y. // JETP. 2011. V. 112. P. 102.
- 19. Barbier M., Vasilopoulos P., Peeters F.M. // Physical Review B. 2010. V. 81. P. 075438.
- 20. Завьялов Д.В., Конченков В.И., Крючков С.В. // ФТП. 2012. Т. 46. В. 1. С. 113.
- 21. Kryuchkov S.V., Kukhar' E.I. // Physica E. 2012. V. 46. P. 25.
- 22. Killi M., Wu S., Paramekanti A. // International Journal of Modern Physics B. 2012. V. 26. P. 1242007.

- 23. Sattari F., Faizabadi E. // International Journal of Modern Physics B. 2013. V. 27. P. 1350024.
- 24. Романов Ю.А., Романова Ю.Ю. // ФТП. 2005. Т. 39. В. 1. С. 162.
- 25. Hyart T., Alekseeva N.V., Mattas J., Alekseev K.N. // Physical Review Letters. 2009. V. 102. P. 140405.
- 26. Басс Ф.Г., Булгаков А.А., Тетервов А.П. (Высокочастотные свойства полупроводников со сверхрешетками). М.: Наука, 1989. 288 с.
- 27. Басс Ф.Г., Крючков С.В., Шаповалов А.И. // ФТП. 1995. Т. 29. В. 1. С. 19.
- 28. Mensah S.Y., Allotey F.K.A., Mensah N.G. // Physica Scripta. 2000. V. 62. P. 212.
- 29. Lonngren K., Scott A. (Solitons in Action). New York: Academic Press, 1978. 312 c.
- 30. Kryuchkov S.V., Kukhar' E.I. // Physica B. 2013. V. 408. P. 188.
- 31. Kryuchkov S.V., Kukhar' E.I., Zav'yalov D.V. // Laser Physics. 2013. V. 23. P. 065902.
- 32. Розанов Н.Н. // УФН. 2000. Т. 170. № 4. С. 462.
- 33. Montesinos G.D., Perez-Garcia V.M., Torres P. // Physica D. 2004. V. 191. P. 193.
- 34. Крючков С.В., Шаповалов А.И. // Оптика и спектроскопия. 1998. Т. 84. № 2. С. 286.
- 35. Крючков С.В., Федоров Э.Г. // ФТП. 2002. Т. 36. В. 3. С. 326.
- 36. Oka T., Aoki H. // Physical Review B. 2009. V. 79. P. 081406(R).
- 37. Abergel D.S.L., Chakraborty T. // Nanotechnology. 2011. V. 22. P. 015203.
- 38. Calvo H.L., Pastawski H.M., Roche S., Foa Torres L.E.F. // Applied Physics Letters.
- 2011. V. 98. P. 232103.
- 39. Kryuchkov S.V., Kukhar' E.I. // Superlattices and Microstructures. 2014. V. 70. P. 70.
- 40. Беленов Э.М., Назаркин А.В. // Письма в ЖЭТФ. 1990. Т. 51. В. 5. С. 252.
- 41. Condat C.A., Guyer R.A., Miller M.D. // Phys. Rev. B. 1983. V. 27. P. 474.
- 42. Campbell D.K., Peyrard M., Solano P. // Physica D. 1986. V. 19. P. 165.
- 43. Mussardo G., Riva V., Sotkov G. // Nucl. Phys. B. 2004. V. 687. P. 189.









- Рис. 1. Зависимость средней энергии электронов от амплитуды ВЧ поля.
- Рис. 2. Зависимость амплитуды диссипативного солитона от амплитуды ВЧ поля.
- Рис. 3. Зависимость площади диссипативного солитона от амплитуды ВЧ поля.
- Рис. 4. Профили диссипативных солитонов.